文章编号 1004-924X(2011)09-2029-07

共光路径向剪切干涉仪的设计

何 煦^{1,2},马 军^{1*}

(1.中国科学院长春光学精密机械与物理研究所,吉林长春 130033;2.中国科学院研究生院,北京 100039)

摘要:针对常规像移式干涉仪无法用于大口径、长光路光学系统波像差检测的工程问题,设计了共光路径向剪切干涉仪 以消除采用标准波面所引入的系统误差。设计中采用由三角棱镜与斜方棱镜组合而成的胶合棱镜组作为波面剪切器 件,将待测波面与其复制波面产生干涉,并通过一组有不同相对孔径的透镜切换装置来控制干涉仪剪切比。与 4D 动态 干涉仪在不同条件下的比对试验数据表明,设计的剪切干涉仪的测试重复精度约为 λ/80,实际测试精度 RMS 优于 λ/20 (λ=630 nm)。这种设计极大地缩小了仪器外形尺寸与重量,提高了超长光路干涉检测的效率。 关 键 词:光学测量;径向剪切干涉仪;波像差

中图分类号:TH744.3 文献标识码:A doi:10.3788/OPE.20111909.2029

Design of common path radial shearing interferometer

HE $Xu^{1,2}$, MA Jun^{1*}

(1. Changchun Institute of Optics, Fine Mechanics and Physics, Chinese Academy of Sciences, Changchun 130033, China;
2. Graduate Uiversity of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100039, China) * Corresponding author, E-mail:majun@ciomp.ac.cn

Abstract: As conventional phase shifting interferometers can not test the wavefront aberration from a large diameter and long optical path system accuracely, a new commonpath shearing interferometer is designed to elimnate the system error introduced by the standard wavefront. The new design takes an agglutination prism consisting of a triangular prism and a rhombic prism as a shear device to produce interference by the wavefront under-test with its replication. A group of different relative aperture lens switching devices are used to control the shearing ratio of the shearing interferometer. Compared with the data from 4D dynamic interferometer is about $\lambda/80$ and the accuracy of root mean square is better than $\lambda/80(\lambda=630 \text{ nm})$. The design of the commonpath shearing interferometer greatly reduces its dimension and weight and also improves the experiment efficiency for long optical path interference measurement.

Key words: optical testing; radial shearing interferometer; wavefront aberration

基金项目:国家自然科学基金资助项目(No. 60538020)

收稿日期:2010-11-08;修订日期:2011-01-25.

1 引 言

与经典的 Fizeau, Twyman-Green 干涉仪相 比, 径向波面剪切干涉仪(Radial Shearing Interferometer, RSI)无需标准镜提供参考光束, 克服 了传统干涉仪的某些不足, 目前被广泛应用于光 学表面检测、温度场检测等测试领域。

1959年,Brown 率先对径向剪切干涉仪进行 研究,完成了采用会聚光照明的雅满形干涉仪的 设计^[1]。1961年,Hariharan 和 Sen 设计了一台 同样采用会聚光照明的循环式径向剪切干涉 仪^[2],它通过两个焦距不同的组合透镜实现两波 面剪切比的调节。1964年,Murty 提出了基于开 普勒望远系统的循环式径向剪切干涉仪^[3]。1997 年 Tsuguo Kohno 等利用基于波带片的 Mach-Zehnder 径向剪切干涉仪测量了凹面镜的波前相 位分布,得到了与 ZYGO 干涉仪同样的测试结 果^[4]。国内上海光机所、南京理工大学等单位也 分别对横向与径向剪切干涉仪进行了研究,通过 在 Mach-Zehnder 干涉光路中使用楔角方向正交 放置的楔板实现矢量剪切与相移,并通过双波带 板实现对光学非球面的检测^[5-7]。

常规的径向剪切干涉测量装置大多通过透镜 组或偏振分光镜等组件实现波面剪切,干涉仪最 终的精度由其中各光学组件的实际面形精度通过 相乘关系运算后得到,因此,光路中所采用的光学 平板、分光镜等光学器件的加工、装调精度对干涉 仪的整机测试精度影响很大,甚至部分抵消了剪 切干涉仪无标准镜头的优势。此外诸如基于 Mach-Zehnder 或 Brown 径向剪切光路(或变形 光路)的剪切干涉仪不具备共光路的特性,因此对 环境、震动等检测条件要求较高,只能应用于短光 路、投射光学表面等应用领域的检测过程。

基于上述原因,本文提出了一种采用斜方棱 镜与三角棱镜构成胶合组合棱镜实现波面剪切的 共光路径向剪切干涉仪,该干涉仪无需标准镜即 可以应用于长光路光学干涉检测。

2 组合棱镜剪切干涉仪原理

2.1 波面剪切干涉原理

剪切干涉是通过特殊的光路结构将一个具有

空间相干性的波面剪切为两个相同或相似的波 面,由于两个波面彼此产生空间位置的交叠与分 离,在两波面的重叠区域就形成一组干涉条纹^[8], 根据干涉条纹的形状与条纹分布即可获得原始波 面包含的信息。图1是两种典型的径向剪切干涉 仪的工作原理。



(a)Murty 径向剪切干涉仪 (a)Murty radial shearing interferometer



(b)Jamin 径向剪切干涉仪 (b)Jamin radial shearing interferometer

图 1 两种典型的径向剪切干涉仪

Fig. 1 Two typical radial shearing interferometers

本文设计的组合棱镜剪切干涉仪利用双通径 向剪切干涉原理,采用特殊的光路设计,具备无需 标准镜、共光路、可调剪切比、外形尺寸相对紧凑 等特点。通过对干涉图的傅里叶变换条纹分析 法,可以直接对干涉条纹进行计算,从而获得波面 的实际畸变,其光路结构如图 2 所示。



图 2 胶合棱镜径向剪切干涉仪光路原理

Fig. 2 Principle of agglutinated prism shearing interferometer

2.2 复合棱镜径向剪切干涉仪工作原理

径向剪切干涉仪光路由半导体激光光源(λ = 630 nm)、胶合棱镜组件、剪切比控制镜(L_2)、扩 束镜、空间滤波器、准直镜(L_1)、成像镜组、偏振 片(P_1 , P_2)、CCD 接收器等组成。

光路结构采用同轴共光路形式,共光路干涉 系统具有对振动、温度和气流的变化能产生彼此 共模抑制的优点,在隔振条件和恒温条件较低时 也能获得稳定的干涉条纹。因此,具有抗干扰特 性的共光路径向剪切干涉光路较为适合于长光路 条件下光学系统波像差的实时检测与监控。

半导体激光器出射的光束经物镜、空间滤波器后,由准直透镜 L₁ 扩束为平面波,经 P₁ 偏振 片,进入胶合棱镜。

胶合棱镜由三角棱镜与斜方棱镜胶合而成。 其中三角棱镜为锐角为 45°的等腰直角棱镜,斜 方棱镜锐角也为 45°。三角棱镜与斜方棱镜的胶 合面是分束面,入射光在分束面上剪切为参考光 与测试光。

在分束面反射的偏振光,即 s-偏振光,经偏振 分光面反射进入被测光学系统(图中由待测球面 反射镜表示),由于其口径与待测波前相比只占有 极小的一部分(可近似为点干涉),因此可作为参 考光束。另一束透射偏振光,即 p-偏振光束,透 过偏振分光面进入斜方棱镜并反射,经 L₂ 凸透镜 匹配相对孔径后进入被检光学系统,并充满全口 径。两束偏振光经被检光学系统反射后,互换位 置。其中:s-偏振光返回时经 L₂ 透镜透射、斜方 棱镜反射、偏振分光面反射进入 P2 检偏器、成像 系统,由探测器接收作为干涉仪的参考波面。 p-偏振光返回时经三角棱镜和偏振分光面透射后进 入 P2 检偏器和成像系统,与参考波面干涉并由探 测器接收。通过对干涉条纹的计算即可获得待测 光学系统的波面畸变(或波像差)信息。

3 剪切干涉的波面求解与重建

3.1 径向剪切干涉波面的求解

该径向剪切干涉仪主要用于长焦距反射式平 行光管波像差的检测与监控,为双通径向剪切干 涉仪。与单通径向剪切干涉仪相比,其测试原理 如图 3 所示,光束需来回两次通过光学系统。为 了避免反射回来的波前和初始波前产生干涉,利 用偏振器(P₁,P₂)改变反射光束的偏振态。



图 3 双通径向剪切干涉原理



设待测波面位于 (r, θ) 极坐标系中,则待测 波前可以表示为 $W(R,\theta)$,由 $W(R,\theta)$ 分束后可表 示为 $W(r,\theta)$ 与 $W(rt,\theta)$,其中t为剪切比: $t=S_1/S_2$,式中 S_1 与 S_2 为两剪切波面的孔径。于是径 向剪切干涉仪中两剪切波面交叠区域的光强分布 可表示为^[9]:

$$\begin{split} I(r,\theta) &= |I\exp[ikW(r,\theta)] + I\exp[ikW(rt,\theta)]^2| = \\ &|A|^2 \{2 + 2\cos[kW_{\text{OPD}}(r,\theta)]\}, \quad (1) \\ \textbf{式中}, W_{\text{OPD}}(r,\theta) 是两剪切波面的波像差, 可表示 \end{split}$$

为:

 $W_{\text{OPD}}(r,\theta) = W(r,\theta) - W(rt,\theta) , \qquad (2)$

对式(2)进行数学处理,并重复进行 *n* 次迭代可表示为如下形式:

$$W_{\text{OPD}}(rt,\theta) = W(rt,\theta) - W(rt^2,\theta)$$

:

$$\sum_{i=1}^{n} W_{\text{OPD}}(rt^{i},\theta) = W(r,\theta) - W(rt^{n},\theta) .$$
 (3)

根据公式 3 所表达的实际物理意义,当迭代 次数 n 趋于无限大时, $W(rt^n, \theta)$ 表示波面的中心 点,其波面为一点,可表示为常数 W_{e} ,则公式 3 可 表示为:

$$W(r,\theta) = \sum_{i=1}^{n} W_{\text{OPD}}(rt^{i},\theta) - W_{c} , \quad (4)$$

即:

$$W(R,\theta) = \sum_{i=1}^{n} W_{\text{OPD}}(Rt^{i},\theta) - W_{\text{c}}.$$
 (5)

3.2 条纹处理及波前的重建

公式 5 中的 W_{OPD}(*Rtⁱ*, *θ*)可通过对干涉条纹 进行解调而获得,即可采用傅里叶变换条纹分析 法对干涉条纹进行计算^[10]。调制后的干涉条纹 的光强可以表示为如下形式:

 $\omega(x,y) = a(x,y) + i(x,y) \cos[2\pi f x + \phi(x,y)],$ (6)

式(6)中a(x,y)表示本底光强,i(x,y)是振幅, ϕ (x,y)表示相位差,将公式(6)表示为指数形式。

$$\omega(x,y) = a(x,y) + i'(x,y) \exp(2\pi j f x +$$

$$i' \times (x, y) \exp(-2\pi j f x)$$
, (7)

对式 6 进行沿 x 方向的一维傅里叶变换:

 $W(f_x, y) = A(f_x, y) + I'(f_x - f, y) + I' \times (f_x - f, y) ,$ (8)

式(8)中的 $W,A,I'表示\omega,a,i'$ 的傅里叶变换, f_x 表示沿x方向的空间频率。当 f_x 大于该方向的 截止频率f时,则在剪切交叠区域内由截止频率 f所确定的正、负一级谱分量和零级谱就可以充 分展开。在式(8)中, $A(f_x,y)$ 表示零级谱分量, 后两项分别表示正、负一级谱分量。通过对条纹 的图像处理可以计算出其中的一级谱分量,可得 $I'(f_x,y)$ 。对 $I'(f_x,y)$ 进行傅里叶逆变换,得:

 $i'(f_x, y) = F^{-1}\{I'(f_x, y)\}$, (9) 则被测波前的相位分布可以表示为如下形式:

$$\phi(x,y) = \arctan\left\{\frac{\operatorname{Im}\left[i'(x,y)\right]}{\operatorname{Re}\left[i'(x,y)\right]}\right\}, \quad (10)$$

式(10)中的 Im 与 Re 分别表示取实部和虚部函数。则 $W_{OPDx} = \lambda \phi(x, y)/2\pi$, 对 W_{OPDx} 沿 x 方向进行积分, 可得:

$$W_{\text{OPD}}(x,y) = \left[W_{\text{OPD}x}(x,y) \,\mathrm{d}x \,. \quad (11) \right]$$

将计算结果转化为极坐标形式,再代入式(5) 即可以计算出 *x* 方向的波面面形,同理可计算 *y* 方向的波面面形;拟合后即获得待测系统与剪切 参考波面的波像差。

4 剪切干涉仪光机系统设计实例

该剪切干涉仪的光机系统采用双层结构设 计,中间层布置干涉仪的主光路结构,包括激光器 光源、扩束镜组件、偏振片 P₁ 和胶合棱镜组件。

在主光路结构的后侧是可调偏振片组件 P₂ 和 CCD 接收器。

在主光路结构之前设计了相对孔径为 $F \ddagger 4$ ~ $F \ddagger 20$ 的相对孔径匹配镜组。进行不同光学系 统波像差检测时可根据需求对其进行切换,从而 实现不同的剪切比。切换转盘通过弹性钢球实现 切换定位。探测器为 2 048 pixel×1 536 pixel 的 彩色低照度 CCD,CCD 与其前端的显微照相物镜 相连。

激光器采用波长为 630 nm 的半导体激光器,具有较高的相干性与低发热量(无需散热),激 光器与电源共同集成在干涉仪壳体内。

经过对干涉仪整体光路以及机械结构系统的 优化与排布,系统的整体外形尺寸为142 mm× 46 mm×78 mm,在保证测试精度的前提下,其外 形尺寸与结构重量远远小于传统的 Fizeau、Twyman-Green 型干涉仪,与常规基于 Mach-Zehnder 光路结构的剪切干涉仪相比,其抗干扰能 力、外形尺寸、重量也具有一定优势。该型球面径 向剪切干涉仪光机系统的设计结果如图4 所示。



Fig. 4 Design of shearing interferometer



图 5 剪切干涉仪结构设计 Fig. 5 Machinery of shearing interferometer

5 剪切干涉仪标定试验

干涉仪完成装调后,采用比对试验的方法对 其实际的测试精度进行标定。在标定试验中使用 研制的剪切干涉仪与商用 4D 动态干涉仪在不同 温度条件下所测试的光学系统波像差进行比对。

标定试验中的测试对象为牛顿式平行光管的 波像差。平行光管焦距为 20 m, 口径为 1 000 mm。使用干涉仪进行标定试验时, 对应的测试 光路达到 40 m(此条件下 ZYGO 干涉仪已经无 法稳定地采集干涉条纹), 测试实验室的温度为± 5 ℃。进行标定实验时, 在平行光管焦面位置安 装分束镜, 使 4D 动态干涉仪与剪切干涉仪同时 (在同一温度点)采集待测平行光管的波前。使用 1 m 口径的标准平面反射镜 (RMS = $\lambda/50$, λ = 632.8 nm)与平行光管、干涉仪构成准直测试光 路。标定试验过程中采集的干涉条纹如图 6 所 示。

表1列举了径向剪切干涉仪与4D动态干涉 仪在不同温度点测试数据的比对结果。



(a)RMS= $\lambda/17$,PV= $\lambda/3$, λ =630 nm,t=23 °C



(b) RMS= $\lambda/18$, PV= $\lambda/4$, λ =630 nm, t=24 °C



(c) RMS=λ/18, PV=λ/4, λ=630 nm, t=25 ℃
图 6 实测的干涉条纹与计算的波面
Fig. 6 Fringes and wavefronts of examination

表1 比对试验测试结果

Tab. 1 Data of parallel experiment

剪切干涉仪测	4D 测试结果	温度	湿度
试结果(RMS)	(RMS)	/℃	(%)
$\lambda/15$	$\lambda/18$	25	70
$\lambda/14$	$\lambda/17$	25	70
$\lambda/16$	$\lambda/18$	24	69
$\lambda/15$	$\lambda/17$	23	69
$\lambda/15$	$\lambda/17$	23.5	69
$\lambda/15$	$\lambda/17$	23	67
$\lambda/14$	$\lambda/17$	23	67
$\lambda/12$	$\lambda/17$	23	68
$\lambda/14$	$\lambda/16$	23	65
$\lambda/16$	$\lambda/17$	23	65
$\lambda/15$	$\lambda/17$	23	64
$\lambda/14$	$\lambda/17$	22.5	60
$\lambda/13$	$\lambda/17$	23	60
$\lambda/15$	$\lambda/17$	23.5	60
$\lambda/14$	$\lambda/18$	24	60
$\lambda/15$	$\lambda/18$	24	60
$\lambda/15$	$\lambda/17$	23.5	60
$\lambda/16$	$\lambda/17$	22	55
$\lambda/17$	$\lambda/17$	22	55

比对结果表明:除个别数据点存在粗大误差 外,径向剪切干涉仪的波像差均方根值测试结果 与相同条件下 4D 动态干涉仪的测试结果的平均 偏差<30%,试验中所使用的 4D 动态干涉仪的 RMS测试精度优于 λ /100。考虑到图像处理过 程中的系统误差,径向剪切干涉仪的测试精度优 于 λ /20(RMS, λ =630 nm)。



图 7 剪切干涉仪实物照片 Fig. 7 Photograph of shearing interferometer

参考文献:

- [1] MALACARA D. Optical Shop Testing [M]. New York: Wiley, 1994:214-216.
- [2] HARIHARAN P, STEEL W H. Fringe localization depth: a comment[J]. Applied Optics, 1989, 28
 (3):20-29.
- [3] MURTY M, SHUKLA R P. Radial shearing interferometers using a Laser source [J]. Applied Optics. 1973, 12 (11): 2765-2767.
- [4] WALDEMAR W K. Corneal topography measurement by means of radial shearing interference: part 1-theoretical consideration [J]. Optical Engineering, 2002, 113(1):39-45.
- [5] 马力,韩道福. 用双光收缩式径向剪切干涉仪测量 气体温度场[J]. 光学学报,2005,25(11):1494-1496.

MA L, HAN D F. Two-beam-contracted radial shearing interferometer for measuring the gas temperature field [J]. *Acta Optica Science*, 2005, 25 (11):1494-1496. (in Chinese)

[6] 王利娟,刘立人. 相移雅满横向剪切干涉仪[J].中
 国激光,2009,36(5):1156-1159.
 WANG L J, LIU L R. Phase shifting jamin lateral

6 结 论

设计了新型共光路径向剪切干涉光路结构, 采用三角棱镜与斜方棱镜胶合而成的组合棱镜对 波前进行剪切,可以应用于反射式光学系统的波 像差检测。与传统的静态干涉仪相比,设计的共 光路径向剪切干涉系统可以应用于超长光路的测 试,同时具有调试相对简单、外形尺寸较小的优 势。

同环境下与 4D 动态干涉仪进行了比对试验,完成了对 20 m 焦距平行光管波像差的检测 试验。结果显示,研制的径向剪切干涉仪的测试 精度优于 λ/20(RMS, λ=630 nm)。

shearing interferomater[J]. Chinese Journal of Lasers, 2009, 36(5):1156-1159.

- [7] 徐荣伟,刘宏展,刘立人. 马赫曾德尔型相移矢量剪 切干涉仪[J]. 光学学报,2006,26(2):269-274.
 XU R W,LIU H ZH,LIU L R. Phase-shifting vectorial-shearing interferometer with Mach-Zehnder configuration [J]. Acta Optica Science, 2006,26 (2):269-274.
- [8] 张斌,马力,王鸣,等.使用双波带板径向剪切干涉 (2位测非球面镜[J].激光技术,2007,31(1):37-46.

ZHANG B, MA L, WANG M, *et al.*. Aspheric lens testing by means of compact radial shearing interferometer with two zone plates [J]. *Laser Technology*, 2007, 31(1):37-46.

- [9] HARIHARAN P, OREB B F, ZHOU W Z. Digital radial shearing interferometry: testing mirrors with a central hole [J]. *Opt Acta*, 1986, 33(3):251-254.
- [10] 冯胜,吴健,郑春燕. 径向剪切干涉仪[J]. 激光与 红外工程,2008,37(9):188-192.
 FENG SH, WU J, ZHENG CH Y. Radial shearing interferomete[J]. Infrared and Laser Engineering, 2008, 37(9):188-192. (in Chinese)

何 煦,等:共光路径向剪切干涉仪的设计

作者简介:



何 煦(1981-),男,吉林长春人,博士 研究生,主要从事光学系统检测和装调 技术的研究。E-mail:911max@sina. com

通讯作者:



马 军(1961一),男,吉林长春人,研究员,主要从事精密光学检测技术和光学 仪器的研究。E-mail:majun@ciomp. ac.cn

●下期预告

利用电场与磁场耦合制备微型化频率选择表面

徐念喜^{1,2},高劲松¹,梁凤超¹,赵晶丽¹,冯晓国¹

(1.中国科学院长春光学精密机械与物理研究所中国科学院光学系统先进制造技术重点实验室, 吉林长春130033;2.中国科学院研究生院, 北京100039)

为了实现频率选择表面(FSS)微型化,利用感性表面(金属栅格)与容性表面(间隔的金属环形贴 片)之间的耦合机制制备了微型频率选择表面(MEFSS)。依据传输线理论给出电感、电容近似公式,定 性分析了 MEFSS 结构参数,采用全波分析矢量模匹配法计算了不同几何结构参数与耦合层电参数 MEFSS 的传输特性,通过镀膜与光刻法在 500 μ m 厚聚酰亚胺膜两侧以矩形排列方式制备了 12 个 0.125λ集总电感单元与集总电容单元,利用自由空间法测试了 240 mm×240 mmMEFSS 样件的传输 特性。结果显示:测试样件中心频点 f_0 为14.636 GHz、透过率为-0.382 dB、-3 dB 带宽为 2.17 GHz 时单元尺寸为 0.125λ。当单元尺寸变小时,中心频点向高频漂移,其透过率下降;固定单元尺寸,中心 频点随某些参量增加向高频漂移;耦合层厚度增加 0.4 mm 中心频点向低频漂移 1.4 GHz 且透过率降 低 2.6 dB,相对介电常数由 3.5 变为 2,中心频点高漂 2.8 GHz。结论认为,利用感性与容性表面耦合 机制能制备单元尺寸为 0.125λ 的 FSS,具有微型化、宽通带和对入射波角度不敏感的特点。